

기술규격평가결과 (업체명 : 파크시스템스 주식회사 )

평가항목		배점	위원별 점수					총점 (평균)
			A	B	C	D	E	
일반부문 (20점)	<b>o 업체 일반현황</b> - 제안 개요 및 제안사의 일반현황, 주요연혁, 주요 사업 분야, 기술인력 현황	10점	10	10	10	10	10	10점
	<b>o 기업신용도</b> - 신용평가에 따른 경영 상태	10점	9.2	9.2	9.2	9.2	9.2	9.2점
기술부문 (60점)	<b>o 공고 규격의 적합성</b> I. 이중 액티브 진동 차단 시스템과 일체형 차폐 장치 - 진동 상쇄 주파수 범위: 0.7Hz ~1kHz - 소음 차단 수준: -40dB 미만 (10Hz ~ 100Hz) - 최대 중량: 150kg II. Scanning capacitance microscopy (SCM) - RF frequency: 600 ~2000MHz III. Variable enhanced conductive AFM - DC bias: ± 10V - Gain range: 7 steps( $10^3$ to $10^9$ V/A) 이상 - 최대 측정 전류 범위: -10mA ~ 10mA - Spectroscopy 범위: I (1pA ~ 10mA) / V (-10 V ~ +10V) - 전류 노이즈: 0.3pA 미만 - Cut-off 주파수: 1.2kHz 혹은 동등 IV. Electrostatic force microscopy (EFM) - Frequency range: DC ~ 3MHz 이하 V. High voltage tool kit - High voltage amplifier 포함	30점	30	30	30	30	30	30점
	<b>o 설비능력</b> - Resolution: 0.01nm 이하 - Out-of-plane curvature: 1nm 미만(80 $\mu$ m 측정 시) - XY stage movement: 200mm x 200mm 이하 - XY measurement area: 100um x 100um 이하 - X,Y 해상도/반복도: 0.5 $\mu$ m / 2 $\mu$ m (단방향), 3	30점	30	30	30	30	30	30점

	<p>μm (양방향)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Z 축 해상도/반복도: 0.08μm / 1μm</li> <li>- 수직 측정 영역 : 최대 15μm</li> <li>- 수직 stage movement: 25mm</li> <li>- DC/AC bias range: ±300 V(External), ±10 V(internal) / ± 10V</li> </ul>							
<b>품질보증 계획의 적정성 (20점)</b>	<b>o 사후 관리 및 추진체계</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 장비 유지보수, 인력운영계획</li> <li>- 유지보수를 위한 부품수급의 용이성</li> <li>- 납품 및 설치일정표 등의 적합성</li> </ul>	10점	5	5	5	10	5	6점
	<b>o 교육훈련 및 기타 제안</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 교육훈련 계획</li> <li>- 기타 제안 사항</li> </ul>	10점	5	5	10	5	5	6점
<b>합 계</b>		<b>100점</b>						<b>91.2점</b>